

JASIS コンファレンス 2017 への参加

近藤 みずき 分析支援グループ

1. はじめに

平成 29 年 9 月 6 日（水）～8 日（金）まで一般社団法人 日本分析機器工業会および一般社団法人 日本科学機器協会が主催する JASIS2017 に参加した。JASIS (Japan Analytical & Instruments Show) は、2012 年の第 50 回分析展（日本分析機器工業会）と第 35 回科学機器展（日本科学機器協会）を機に、合同展の統一名称として決められたものである。JASIS はアジア最大級の分析・科学機器関連のイベントであり、展示会場では 500 社、コンファレンスは 30 団体の 50 セッション、新技術説明会 350 テーマが行われた。

2. 研修内容

今回下記のセミナーに参加した。

○9 月 6 日 10:00～16:55

主催：表面化学分析技術国際標準化委員会

「表面化学分析・マイクロビームアナリシスにおける国際標準化の動向」

○9 月 7 日 10:30～16:30

主催：産業技術総合研究所軽量標準総合センター

「化学分析の信頼性確保のための基礎知識」

○9 月 8 日 9:00～17:00

主催：一般社団法人表面分析研究会

「分析現場ですぐに役立つ表面分析のノウハウと知識」

今回のセミナーで共通することは国際規格に関する国際標準化機構（ISO）や日本の国家標準である日本工業規格（JIS）の言葉が多く見られた。これらの背景にあるものは、今まで JIS や ISO 規格ではなく、各部署に伝わる技術やノウハウ、社内標準に従って業務が行われていたが、産業のグローバル化に伴って分析評価の重要性が世界的

に再認識され、国際標準に従った分析評価（測定・解析・報告）が不可欠となっていること。さらに、現在注目されているビックデータ解析、AI による材料・デバイス開発においてはデータの再現性や信頼性が最重要項目であり、JIS や ISO 規格に従った分析評価が必須となっていることが挙げられていた。

「分析現場ですぐに役立つ表面分析のノウハウと知識」のセミナーでは、表面分析概論から始まり、AES/XPS/SIMS の基礎、試料の取り扱いと前処理、各分析の勘どころといった内容で、実に実用的な内容であった。

また、展示会場では、分析機器／科学機器の技術トレンド・市場動向調査を行うことができた。特に、最新の機種は利用者にとって使いやすいユーザーフレンドリーな装置が目立っていた。



3. おわりに

セミナーでは、特に分析計測センターにて担当しているオージェ電子分光装置に関する表面分析のノウハウとして具体的に試料の取り扱いや試料の前処理といった日頃の分析業務へ直接活かせるような具体的な内容のセミナーを受講することができ、大変有意義な研修であった。今回の研修で得られた情報等は、分析支援グループ内で共有し、今後の日常業務に役立てていきたい。